

Olympus LMPLN5XIR 5X NIR-Objektiv

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Olympus LMPLN5XIR 5X NIR Objective

Produkt #90-480 **NEU** **KONTAKT**

- 1 + €3.615⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€3.615,00 stückpreis
---------	----------------------

Need More?	Angebotsanfrage
------------	---------------------------------

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

LMPLN5XIR **Modellnummer:**

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm

Microscope Objective **Typ:**

Infinity Corrected **Art:**

Olympus Hersteller:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
4.40

Länge ohne Gewinde (mm):
21.50

Max. Durchmesser (mm):
24.00

Gewicht (g):
55

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A

Brennweite BW (mm):
36.00

Vergrößerung:
5X

Numerische Apertur NA:
0.10

Auflösung (μm):
3.35

Tiefenschärfe (μm):
27.50

Arbeitsabstand (mm):
23.00

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1600

Feldzahl:
22

Parfokallänge (mm):
45

Immersionsflüssigkeit:
N/A

Entrance Pupil Diameter (mm):
7.20

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

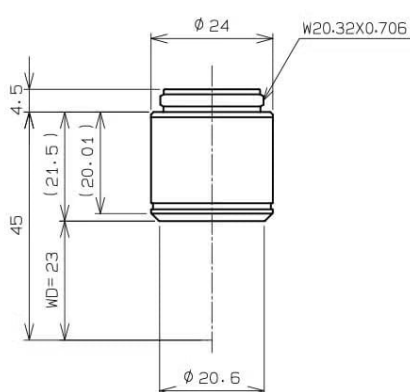
Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

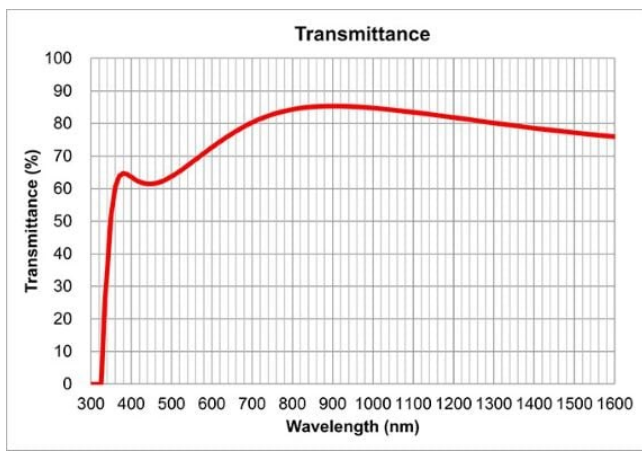
Produktdetails

- Lange Arbeitsabstände reduzieren das Risiko, die Proben zu beschädigen
- Korrekturring zur Anpassung an die Probendicke
- Ideal für die Inspektion von Siliziumwafern

Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich bieten eine hohe Transmission zwischen 700 und 1600 nm, was sie in Verbindung mit einer NIR-Tubulinse zu einer hervorragenden Wahl für die Nahinfrarot-Mikroskopie macht. Diese Objektive zeichnen sich durch große Arbeitsabstände aus, was das Risiko, Proben zu beschädigen, verringert. Sie unterstützen Beobachtungen bis zur Sehfeldzahl 22. Vergrößerungen von 20X und höher verfügen über einen Korrekturring, um Aberrationen in Abhängigkeit von der Dicke des zu prüfenden Glas- oder Siliziumsubstrats zu korrigieren. Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich sind ideal für die Inspektion von Silizium-Wafern geeignet, um die innere Struktur auf Defekte zu untersuchen.

Technische Informationen





LMPLN5XIR Transmission Graph

;